Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Paten Reexamination	t under
10/602,902	HARMLESS ET A	۱L.
Examiner	Art Unit	
Betsey M. Hoey	1724	

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
210	7148					
	739	. \				
	760					
	760					
422	105	V	V			
	119	4/4/05	BMH			
			·			
			4.			

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
l					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)					
		DATE	EXMR		
inventor	name	6/6/05	BMA		
	į				
·					
· .					
	·				
					